

Для переходов 2-го рода граница не локализована и $\alpha=0$.

Условия $\mu_k(p, T, C_k)=\mu_c(p, T, C_c)$ для каждого из компонентов кристалла и среды определяют связь p, T и концентрации компонентов C , при к-рых кристалл находится в равновесии со средой, т. е. диаграмму состояния вещества. Разность $\Delta\mu=\mu_c-\mu_k$, являющаяся мерой отклонения от равновесия, наз. термодинамич. давлением силои К. Обычно она создаётся понижением темп-ры ниже равновесного значения T_0 , т. е. переохлаждением системы на $\Delta T=T_0-T$. Если $\Delta T < T_0$, то

$$\Delta\mu=-\Delta H \Delta T / T_0. \quad (2)$$

Если давление p паров или концентрация C в растворе большие равновесных значений p_0 и C_0 , то говорят об abs. пересыщении ($\Delta p=p-p_0$ или $\Delta C=C-C_0$) либо относит. пересыщении ($\sigma=\Delta p/p_0$ или $\Delta C/C_0$). В этом случае в разреженных парах и разведённых растворах

$$\Delta\mu \approx kT \ln(1+\sigma). \quad (3)$$

В процессе выращивания монокристаллов из растворов обычно $\sigma \leq 0,1$, из паров и при хим. реакциях $\sigma \leq 1$, при конденсации молекулярных пучков $\sigma \geq 10^2-10^4$.

К. может происходить в результате или с участием хим. реакций. Равновесное состояние смеси газов при возможной хим. реакции между составляющими её веществами A_i можно обобщённо записать в виде $\sum_i v_i A_i = 0$, где v_i — стехиометрич. коэф. ($v_i < 0$ для прямой реакции, $v_i > 0$ — для обратной). В этом случае

$$\Delta\mu = \frac{KT \ln \prod_i p_i^{v_i}}{kT}. \quad (4)$$

Здесь K — константа равновесия реакции, p_i — парциальные давления (или концентрации, если реакция протекает в растворе). В случае электролитов

$$\Delta\mu = Ze\eta, \quad (5)$$

где Ze — заряд иона (Z — ат. номер), η — отклонение разности потенциалов между кристаллом и раствором от равновесного значения.

Зародыши кристаллизации. Пересыщенная или переохлаждённая фаза может сохранять своё состояние чрезвычайно долго (К. не идёт). Такое состояние наз. метастабильным. Расплавы чистых металлов переохлаждаются на $\Delta T=(0,3-0,5) T_0$, вода — на $\Delta T \sim 40 K \approx 0,15 T_0$, пары — до $\sigma \approx 10$, растворы — до $\sigma \approx 3$. Стёкла могут быть охлаждены до 0К (см. Аморфное состояние). Загрязнённые среды кристаллизуются на посторонних частицах (центры К.) при небольших ΔT . Критич. переохлаждение ΔT зависит также от темп-ры, материала и состояния стенок сосуда, действия излучений. Причина такой устойчивости — в трудности зарождения кристаллов. Атомы и молекулы газа или жидкости могут при соударениях соединяться в агрегаты из 2, 3 и т. д. частиц. Часть их распадается вследствие флуктуаций колебат. энергии частиц. Если кол-во частиц N в агрегате охватывает 2—4 координац. сферы, то к нему можно применять макроскопич. понятия поверхности энергии и хим. потенциала и др. Ат. структура зародышей пока недостаточно выяснена. Однако есть данные о том, что она может отличаться от структуры устойчивой макроскопической фазы.

Переохлаждение в однородной гомогенной фазе определяется работой образования границы раздела при появлении кристаллич. фазы внутри материнской. Эта работа положительна, если удельная свободная энергия границы $\alpha > 0$. Образование агрегата новой кристаллич. фазы из N частиц с поверхностью $\gamma(\omega_k N)^{2/3}$ увеличивает термодинамич. потенциал Φ системы на величину, равную $\alpha\gamma(\omega_k N)^{2/3}$, где число γ зависит от формы агрегата. Одновременно Φ уменьшается на $N\Delta\mu$,

т. к. новая фаза «выгоднее» старой ($\mu_c > \mu_k$). В результате работы образования зародыша $\delta\Phi = -N\Delta\mu + \alpha\gamma(\omega_k N)^{2/3}$ достигает максимума $\delta\Phi_{kp} = 4(\alpha\gamma)^3 \omega_k / 27 \Delta\mu^2$, когда размер зародыша приобретает критич. значение $N_{kp} = 2\alpha\gamma / 3\Delta\mu$ (рис. 1). Работа образования критич. зародыша $\delta\Phi_{kp}$ минимальна для кристалликов равновесной формы, у к-рых минимальна поверхностная энергия при данном объёме. Критич.

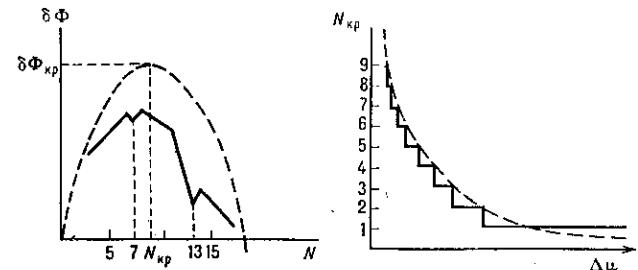


Рис. 1: Работа образования зародыша кристаллизации $\delta\Phi_{kp}$ как функция числа частиц в нём N_{kp} для феноменологической (пунктир) и микроскопической (сплошная линия) моделей.

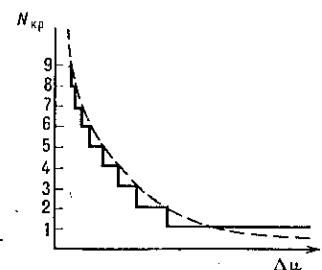


Рис. 2: Зависимость числа частиц в критическом зародыше N_{kp} от переохлаждения для феноменологической (пунктир) и микроскопической (сплошная линия) моделей.

зародыши образуются в результате тепловых флуктуаций. Увеличение степени отклонения от равновесия $\Delta\mu$ уменьшает работу образования зародыша. Скорость зарождения

$$I = B \exp(-\delta\Phi_{kp}/kT), \quad (5)$$

где B пропорционально плотности частиц в среде и скорости их присоединения к критич. зародышу (в очищенных парах и растворах $B \approx 10^{25}-10^{30} \text{ см}^{-3} \text{ с}^{-1}$, в расплавах $B \approx 10^{37}-10^{42} \text{ см}^{-3} \text{ с}^{-1}$). Число частиц в критич. зародыше убывает с переохлаждением (в расплаве Ga при $\Delta T=0,5 T_0$, $N_{kp} \approx 10$ атомов, радиус зародыша $r_s \approx 4 \text{ \AA}$). Т. к. N_{kp} не может меняться меньше чем на 1, то существуют интервалы изменения $\Delta\mu$, в пределах к-рых N_{kp} постоянно (рис. 2). Эти интервалы малы в области умеренных пересыщений, но проявляются при больших, напр. в условиях конденсации молекулярных пучков и электролитич. осаждения, когда $N_{kp} \sim 1-10$. В результате зависимости $\delta\Phi_{kp}(\Delta\mu)$ и $I(\Delta\mu)$ становятся ломаными линиями (рис. 1).

К зародышам из неск. атомов понятие поверхности

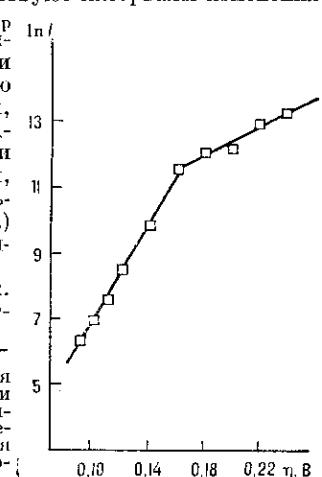


Рис. 3: Скорость зарождения $\ln I$ на аморфном углероде при электролитической кристаллизации в зависимости от переохлаждения $\Delta\mu$: левая прямая отвечает первому атому в зародыше, правая — второму.

ней энергии не применимо, и описание зарождения ведётся на конкретных микроскопич. моделях. Однако для оценок можно пользоваться феноменологич. представлениями, дающими нескользко заниженную скорость зарождения (рис. 1, 2).

Упаковка частиц в малых зародышах может не совпадать с упаковкой в массивном кристалле, напр. обнаружено неск. метастабильных фаз в каплях Ga и Br, замёрзших при глубоких переохлаждениях. Масс-спектральный анализ агрегатов в парах Pb и в Xe обнаружил